

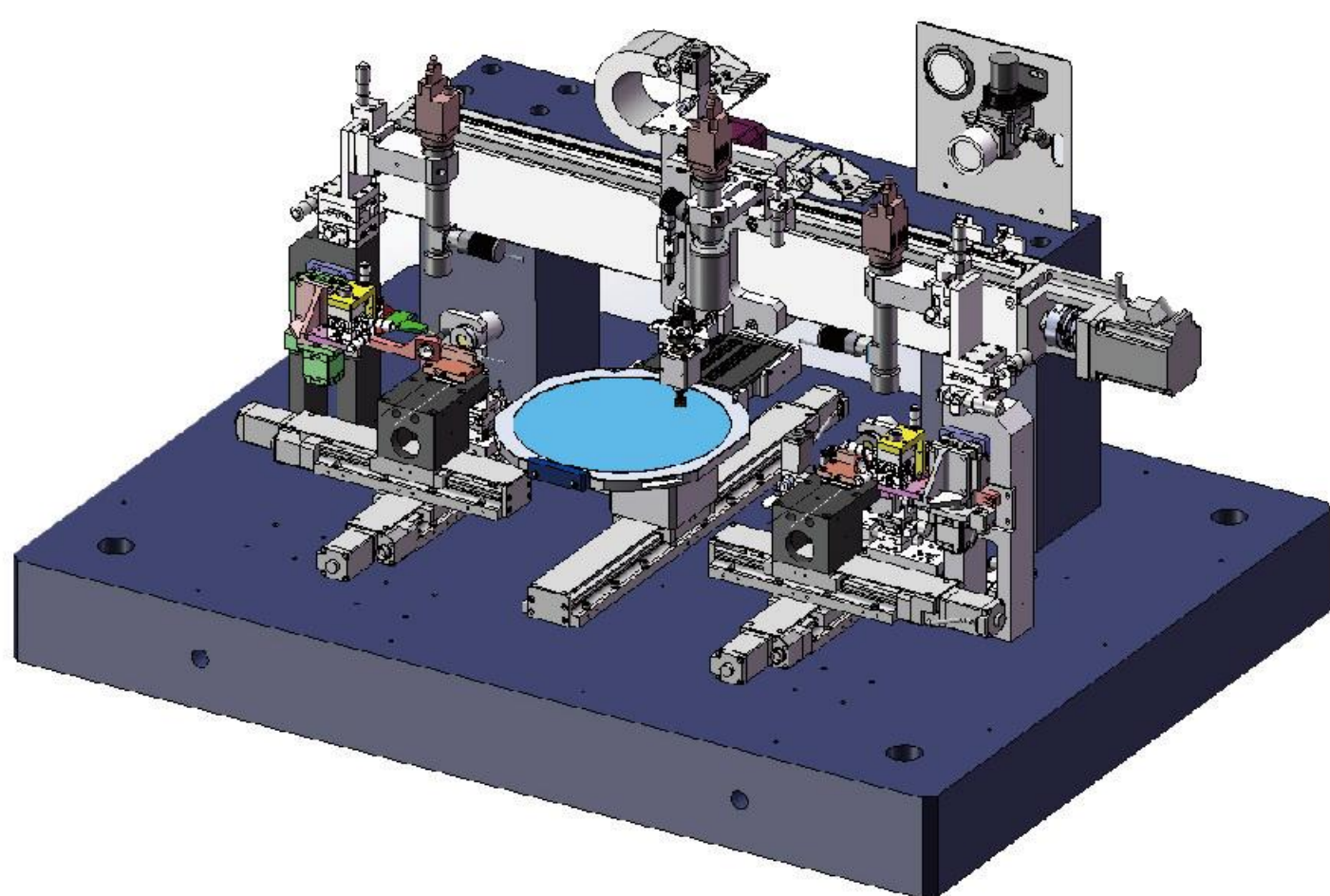
LASER X



Bar测试机

产品特性

- 双平台设计，可同时进行低温、常温、高温的LIV和光谱测试
 - Bar条全自动上下料，具备自动识别、校正和定位功能
- 支持2寸或4寸Tray盒上料，6寸蓝膜下料
 - 支持 Chip 编码的识别
- 支持不合格品打点功能
 - 支持背光功率测试功能



性能参数

类别	项目	指标
PIV	输出电流范围	0~3000mA
	输出电流精度	± (0.1%+1mA)
	扫描步长	10uA
	扫描时间	< 4 ms/点
光谱	光路耦合时间	多模光纤 < 1s
	光路耦合功率	> - 20dBm (透镜+多模光纤)
	波长重复性	±0.005nm
温度特性	控温方式	TEC
	控温范围	20~100℃(可定制0℃低温)
	环境温度一致性	±1℃
	环境温度稳定性	±0.5℃